

先端分析講習会開催のご案内

微小領域の分析技術

～測定原理から最新の応用分析事例まで～

和歌山県工業技術センターでは、県内企業の皆様のものづくりを支援するため、保有機器や基盤技術の充実と共に、分析技術に関する情報発信を行っています。

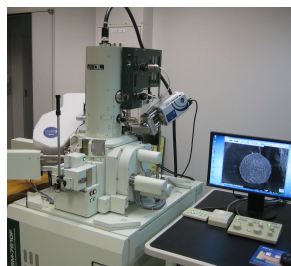
今回は、走査型電子顕微鏡（SEM）を用いた「微小領域の分析技術」に関する講習会を開催します。特にFE-SEM（電界放出型走査型電子顕微鏡）は、通常のSEMと比べて高倍率での観察が可能のため、研究開発から品質管理、トラブル対応などの様々な用途で活用されています。SEMの測定原理、必要となる前処理法、種々の分析事例、さらには最新の応用事例を知ることで、試料の分析結果をより具体的にイメージしていただけます。

日頃、分析業務に携わられている方から、材料の開発業務を実施されている方まで幅広い方々を対象にした講習会です。

どうぞお気軽にご参加ください。

この講習会でわかること

- ◆ FE-SEMとは？
- ◆ どのようなことが調べられる？
- ◆ 測定可能な試料は？
- ◆ 最新の分析事例は？



記

- 1 開催日時：令和5年11月8日（水） 13:00～16:00
- 2 場所：和歌山県工業技術センター（和歌山市小倉60番地）
研究交流棟6階 テクノホール
- 3 内容
 - (1) 「最新走査型電子顕微鏡(SEM)の測定原理とその応用例」
13:00～14:00 日本電子株式会社 作田 裕介 氏
 - (2) 「SEMの前処理・分析技術の紹介」
14:00～14:30 日本電子株式会社 作田 裕介 氏
 - (3) 「ED/WDS分析の最前線と世界初のBEXイメージングシステムによるマッピング技術」
14:45～15:30 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 五十嵐 誠 氏
 - (4) 「SEMとRAMANを組み合わせた相関分析技術の概要と応用例」
15:30～16:00 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 村田 泰斗 氏
- 4 参加費：無料
- 5 参加申込み期限：令和5年11月2日（木）まで

- 6 定員 : 50名 (先着順で締切り)
- 7 参加申込、問合せ : 申込書に必要事項をご記入の上、下記の FAX 又は E-mail でお申込みください。
TEL : 073-477-1271
FAX : 073-477-2880
E-mail : amats [at] wakayama-kg.jp
([at] を@に変換してください)

化学技術部 松本 宛て

先端分析講習会参加申込書

微小領域の分析技術

～測定原理から最新の応用分析事例まで～

企業名	
住所	
電話番号	

参加者名	所属部署	役職	氏名